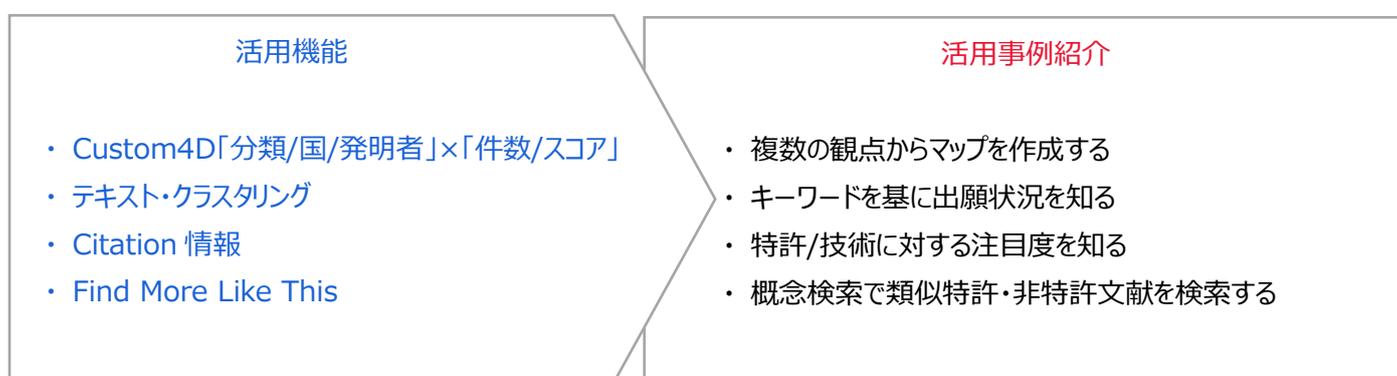


## IP Intelligence Software “INNOGRAPHY” のご紹介

INNOGRAPHY というツールをご存知でしょうか？ 2018 年 9 月、日本のお客様に対してご案内を開始してから、はや 1 年半が経過致しました。お陰様でご契約企業様の数も NGB スタッフの予測を上回るペースで増えております。そんな INNOGRAPHY を皆様にもっと知って頂くため、4 月より、利用目的別の INNOGRAPHY 特徴機能を連載形式にてご紹介しております。

今回はその第 4 回目ということで、「INNOGRAPHY 活用シーン 04：技術動向・先行技術調査」を想定しながら、INNOGRAPHY の特徴機能をご紹介させていただきます。

### INNOGRAPHY 活用シーン 04：技術動向・先行技術調査



なお、8 月以降は以下の利用目的を想定した特徴機能をご紹介する予定です。

2020 年 8 月：INNOGRAPHY 活用シーン 05：M&A、提携先候補の調査

2020 年 9 月：INNOGRAPHY 活用シーン 06：PatentIQ 情報共有機能（自動更新機能あり）

2020 年 9 月：INNOGRAPHY 活用シーン 07：PortfolioIQ 独自情報の活用機能（オプション）

# INNOGRAPHY 活用シーン 04：技術動向・先行技術調査

## Custom4D（分類/国/発明者×件数/スコア）

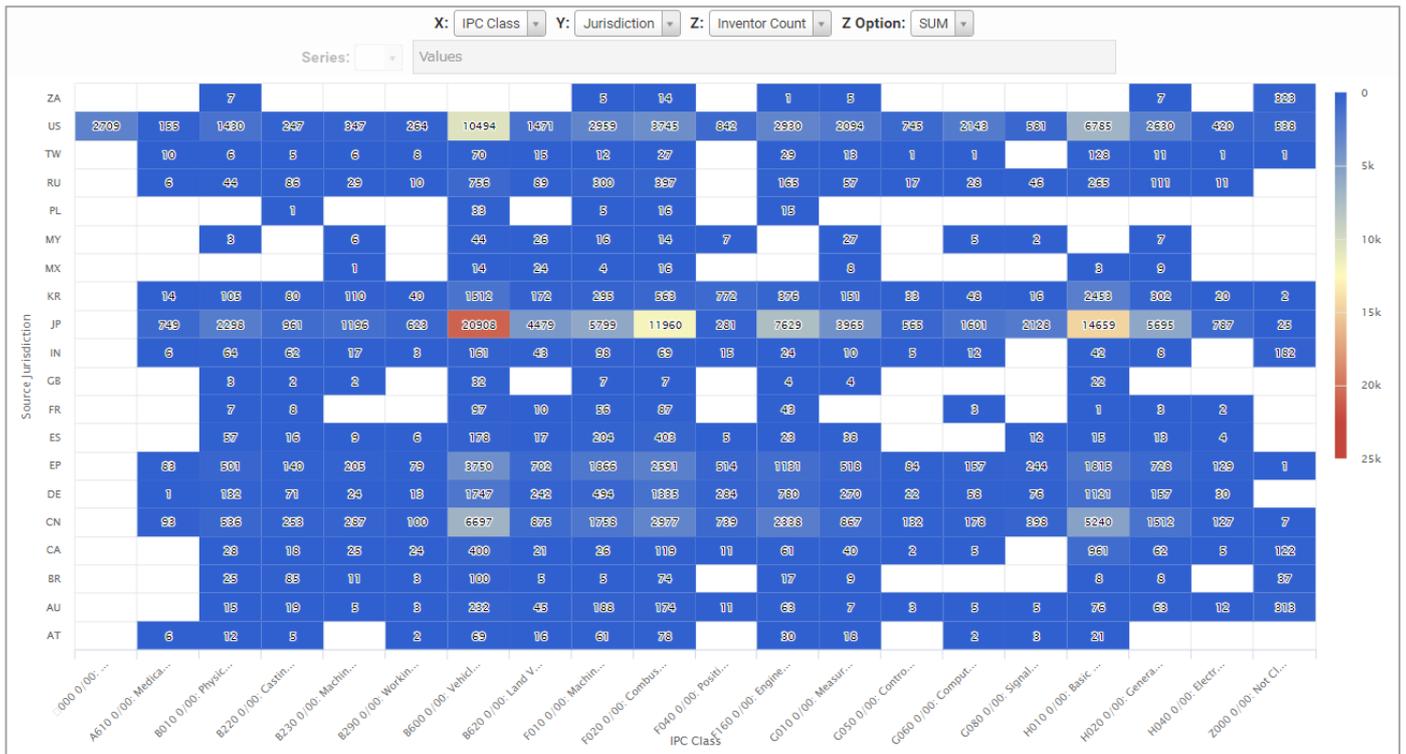
### 複数の観点からマップを作成する

競合企業の保有特許を対象に、様々な観点からマップを作成する。Custom4D の表示形式には Heatmap、Bubble、Line、Bar 等が用意されています。



以下、Custom4D にて選択可能な項目一覧です。表示中のマップはリアイン・ボードを用いて、前提条件を簡単に変更することが可能です。

Series	X 軸 & Y 軸	Z 軸	Z 軸オプション
Organization	Organization	Count	SUM
Jurisdiction	Jurisdiction	Age	AVG
CPC/Section	CPC/Section	Forward Citations	MIN
IPC/Section	CPC/Class	Backward Citations	MAX
USC/Section	CPC/Subclass	Claims	
Original Organization	CPC/Group	Inventor Count	
Inventor	IPC/Section	Rejection Type Count	
Examiner	IPC/Class	Remaining Life	
Rejection Type	IPC/Subclass	Relevance	
Art Unit	IPC/Group	PatentStrength	
Filed Year	USC/Section	First Claim Word Count	
Priority Year	USC/Class	IP Cost	
Publish Year	USC/Subclass L1	Litigation Count	
Expiration Year	USC/Subclass	CustomStrength	
Project Label	Original Organization		
Agent	Inventor		
Law Firm	Examiner		
PortfolioIQ	Rejection Type		
	Art Unit		
	Filed Year		
	Priority Year		
	Publish Year		
	Expiration Year		
	Project Label		
	Agent		
	Law Firm		
	PortfolioIQ		



X : IPC Y : 地域 Z : 発明者数 by Custom4D/Heatmap



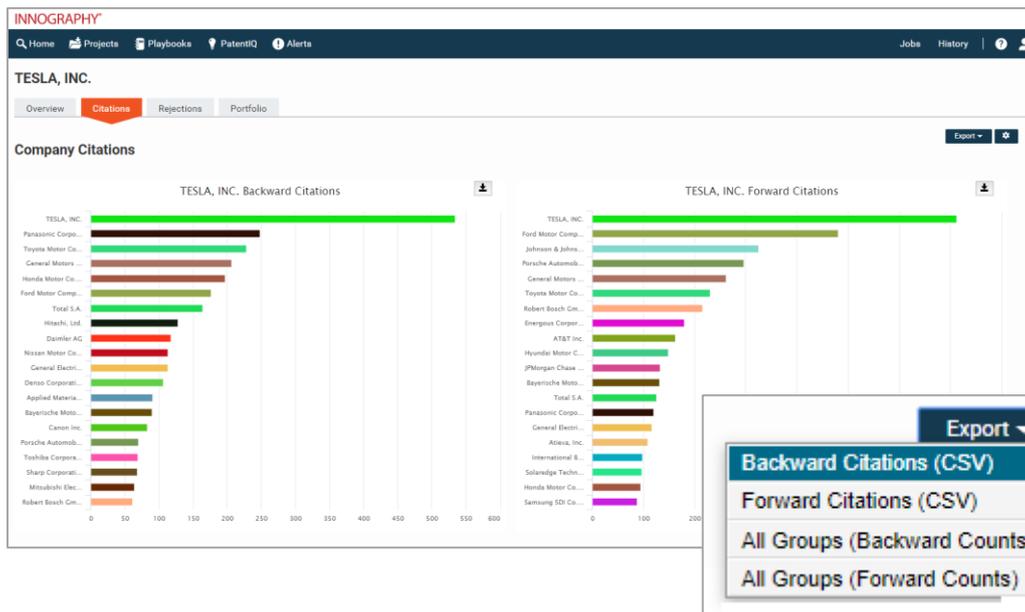
Series : 出願人 X : IPC Y : 地域 Z : 件数



## Citation 情報

### 特許・技術に対する注目度を知る

ターゲット特許、企業の特許を対象に引用・被引用データから保有する特許・技術の注目度を知ることができます。



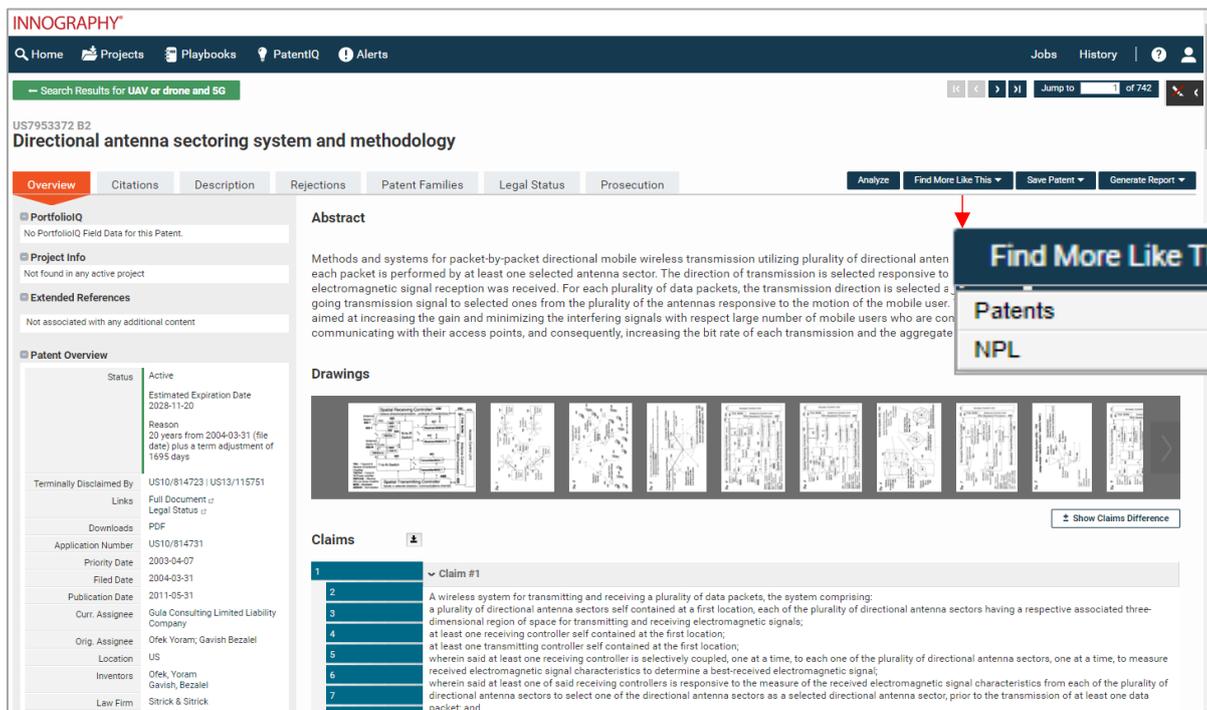
Company 検索結果からターゲット企業の引用・被引用特許の状況が確認できます。

なお、これらのデータは CSV ファイルとして一覧出力することも可能です。

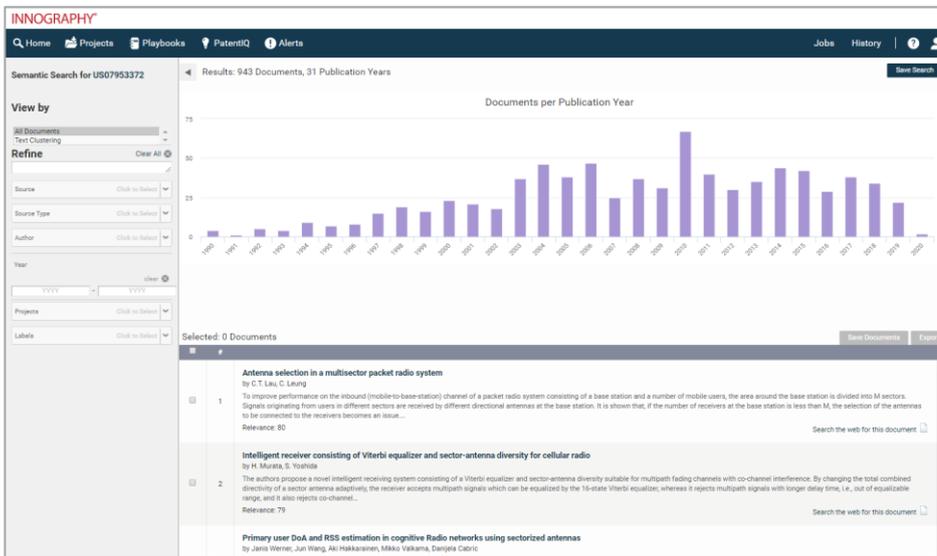
## 「Find More Like This」機能

### 概念検索を用いて類似特許・非特許文献を検索する

「Find More Like This」機能を利用すればワンクリックで関連特許・非特許文献を検索することができます。



表示・閲覧中の特許に関連する情報を収集したい場合には、詳細表示画面にある「Find More Like This」を用いることで簡単に関連する類似特許や非特許文献を検索することができます。



表示中の特許文献から関連する非特許文献を検索しました。

1 件の特許から関連すると思われる 943 件の非特許文献を検索・表示しています。

「特許文献→非特許文献」と同様に「非特許文献→特許文献」をワンクリックで検索することも可能です。

表示・閲覧中の非特許文献に関連する情報を収集したい場合にも、詳細表示画面にある「Find More Like This」を用いることで簡単に関連する類似特許や非特許文献を検索することができます。

なお、「Find More Like This」は Innography が搭載している SEMANTIC 検索機能を用いています。SEMANTIC 検索機能を用いた場合、特許の検索上限数は 8,000 件となります。また、検索対象地域のデフォルトは「US、JP、CN、KR、WO、EP、DE」の 7 地域となっています。1 地域あたり、約 1,000 件程度の特許を抽出します。

SEMANTIC 検索機能を用いて非特許文献の検索を行う場合、その抽出上限数は 1,000 件となっています。

特許	→	特許	8,000 件	US、JP、CN、KR、WO、EP、DE
特許	→	非特許文献	1,000 件	
非特許文献	→	特許	8,000 件	US、JP、CN、KR、WO、EP、DE
非特許文献	→	非特許文献	1,000 件	

以上、Innography を利用した場合の目的別活用例をご紹介しました。ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い合わせ下さい。

日本技術貿易株式会社 IP 総研

長谷川 [mhasegawa@ngb.co.jp](mailto:mhasegawa@ngb.co.jp)

菊田 [momoko.kikuta@ngb.co.jp](mailto:momoko.kikuta@ngb.co.jp)

饗庭 [yuna.aiba@ngb.co.jp](mailto:yuna.aiba@ngb.co.jp)